**2019先進DB-FIB與電鏡技術研討會**

**2019 Advanced DB-FIB and Electron Microscopy**

 **Techniques Seminar**

雙束聚焦離子束(DB-FIB)同時具有微加工以及顯微能力，在微結構分析或樣品前處理程序中已成為不可或缺的工具。隨著其加工能力的提昇以及多元的顯微技術，應用在非半導體產業，如：能源、封裝、高分子以及生醫等領域也日趨增加。本研討會首先由工研院介紹DB-FIB在非半導體領域的應用案例。緊接著由美商飛昱科技股份有限公司介紹最先進之DB-FIB技術的應用，內容將涵蓋三維微結構重建、不同影像偵測器以及生醫化學在材料分析的幫助。最後美商飛昱科技股份有限公司將介紹其最新的電鏡分析技術。使業界先進以及院內研發同仁更了解先進DB-FIB與電鏡技術對於其材料開發的助益。

**主辦單位：**工業技術研究院材料與化工研究所 / 美商飛昱科技股份有限公司

**時間：**中華民國108年6月24日 星期一

**地點：**新竹縣竹東鎮中興路4段195號(工研院中興院區)

 77館101-102會議室

**適合對象：**院內及產業界之材料開發相關研究人員

**講習費用：**免費

**報 名：**即日起至額滿六十人為止。

**報名網址：**[**https://college.itri.org.tw/course/all-events/1205CB60-2B2F-4591-AEA9-7F09937844FC.html**](https://college.itri.org.tw/course/all-events/1205CB60-2B2F-4591-AEA9-7F09937844FC.html)

**洽詢電話：**03-5912600 呂小姐

**電子信箱：**pinkylu@itri.org.tw

**Agenda**

**6/24 (Mon.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Time** | **Topic** | **Lecturer** |
| 8:30 | Registration |  |
| 9:00 | Opening |  |
| 9:20 | Development and practical case of advanced DB-FIB technique in ITRI | Dr. Liu Shih-Yi |
| 10:20 | Tea break |  |
| 10:40 | Multi- scale 3D Characterization of  Battery electrode materials and application of multi-detector in SEM characterization | Dr. Han Wei |
| 12:00 | Lunch |  |
| 13:30 | Electron Microscopy for drug discovery, lead generation and medicinal chemistry | Dr. Chen Eric |
| 14:30 | Tea Break |  |
| 14:40 | The improvement of TEM sample preparation by the new generation DB-FIB. | Dr. Han Wei |
| 15:30 | State-of-the-Art EM technique in Thermo Fisher | Dr. Han Wei |
| 16:00 | Q & A + 大合照 |  |